



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Temadag om digitale kalibreringscertifikater (DCC)

Teknologisk Institut i Taastrup d. 5. oktober 2023

09.30-10:

- *Ankomst, registrering og morgenkaffe*

10:00-11:30:

- *Velkomst og introduktion til DCC – status og teknisk indsigt* v. Jan Nielsen og Jonas Emil Vind, Teknologisk Institut, Center for Installation & Kalibrering
- *“Technical part of the DCC – new updates and software”* v. Thomas Krah, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Germany
- *“Erfaringer med implementering af DCC og Digital Calibration Request (DCR) – end to end kalibreringscase med fokus på datahåndtering”* v. Jonas Emil Vind, Teknologisk Institut
- *“DCC-database og automation”* v. Andreas Lyndrup Jensen, FORCE Technology, Metrology & Calibration

13.10-12.30:

Frokost

12:30 – 14:00:

- *“DCC seen from a customer point of view”* v. Heidi Foldal, Novo Nordisk
- *“High level security-architecture of DCC-exchange”* v. Ahmed Khan Leghari, FORCE Technology, Digital

- *“Deutscher Kalibrierdienst (DKD) activities on harmonization and standardization of DCC”* v. Thomas Krah, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Germany)

- *“Fra kalibreringsresultater til maskinlæsbare data. DFM's tilgang”* v. Søren Kynde, DFM

14:00-14:30

Pause

14:30 – 14:50

- *“Metadata for Machine-Actionable Documents”* v. Mark Kuster, Independent Researcher Consultant, Editor at NCSLI Measure

14:50 – 15:05:

- *“Europæisk metrologikald: SRT-r03 Digital workflows and e-services in metrology for small and medium NMIs”* v. Søren Kynde, DFM

15:05 – 15:25

- Paneldiskussion: *“Overgangen til DCC: Vision og udfordringer”*
 - o David Balslev Harder, DFM (Chair)
 - o Thomas Krah, PTB
 - o Heidi Foldal, Novo Nordisk
 - o Jakob Fester, Teknologisk Institut

15:25 – 15:30

- *Afrunding* v. Torben Vonsild, Teknologisk Institut